

Diffraction des rayons X

Localisation

Pièce : 108
 Bat : 11
 Campus : INSA

Analyse, résultats attendus

Diagramme de diffraction RX

Analyses de phases

Descriptif / Spécialisations Techniques / Options

- Mesure à T° ambiante
- Possibilité d'enregistrement sous atmosphère contrôlée
- Chambre HTK pour mesure en température ((jusqu'à 1000°C)
- MPD Panalytical X'pert Pro, Chambre

Type d'échantillons

Echantillons solides (poudre)



Responsable / Contact

Mail	Olivier.Guillou@insa-rennes.fr
Téléphone	02 23 23 84 38
Équipe	CSM (Chimie du Solide et Matériaux)

Diffusion	Interne <input checked="" type="checkbox"/>	Externe <input checked="" type="checkbox"/>
Service Commun	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>